

国外专利文献题解

机械制造 第七分册

光学仪器

1

上海光学仪器研究室主编

71.27071

国外专利文献题解

机械制造 第七分册

光学仪器

(1)

上海光学仪器研究室主编

*

上海市科学技术编译馆出版

(上海南昌路 59 号)

新华书店上海发行所发行 各地新华书店经售

中华书局上海印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/16 印张 3 字数 93,000
1965 年 3 月第 1 版 1965 年 3 月第 1 次印刷
印数 1—2,000

定 价： 0.35 元

試 刊 說 明

目前，全世界专利文献的积累总量已达一千万件以上，其中美、英、西德、法、日五个主要资本主义国家每年出版的专利文献约有十五万件，占全世界每年公布的专利文献的二分之一左右。为了便于有关专业的科技人员了解和查找上述五国的专利文献，我们特编辑出版“**国外专利文献题解 机械制造第七分册——光学仪器**”专辑。对每一专利除译载其题录外，并将其主要内容概括成题解一并予以报导，使读者在几个同名题录间能够分别其不同特点获知专利的主题内容。

兹将本分册的有关事项分别说明如下：

(1) 资料收集的国别范围：美、英、西德、法、日等五国专利。

(2) 资料所属年份：1963年1月至6月。

(3) 目录的编排次序：目录的编排按主题进行分类，在同一类号下按专利流水号顺序排列。

(4) 外文原题从略。

(5) 每一专利报导项目的顺序说明：

专利流水号	原分类号	分册連續編號
-------	------	--------

題录.....

題解.....

.....。

申請日期

批准年份

(6) 本题解所引各国专利文献的摘要及说明书在国外文献室均有收藏，如欲参阅可逕赴上海长乐路462号阅览或申请复制。

(7) 本分册编译协作单位：上海电影机械设计研究所

上海机械学院

由于这一项比较全面、系统的题解报导工作所涉及的专业面比较广、文种比较多、数量比较大，加以试刊工作准备匆促，编译人员缺乏经验，容有谬误之处，至希读者指正。

目 录

(1963年1—6月)

一、物理光学仪器及其附件

美国	(1)
英国	(3)
西德	(3)
法国	(4)

二、光学计量仪器和测试技术

美国	(6)
英国	(8)
西德	(9)
法国	(11)
日本	(12)

三、大地测量仪器和光学观察仪器

美国	(12)
英国	(13)
西德	(14)
法国	(15)
日本	(16)

四、显微镜

英国	(16)
法国	(16)

五、电影机械和照相设备

美国	(17)
英国	(22)
西德	(26)
法国	(27)

六、光学系统

美国	(28)
英国	(29)

西德 (30)

法国 (31)

七、光学元件和光学材料

美国 (34)

英国 (34)

西德 (35)

法国 (35)

八、眼镜和眼睛检查设备

美国 (36)

英国 (37)

西德 (37)

法国 (38)

九、其它

美国 (40)

英国 (42)

西德 (43)

法国 (44)

日本 (45)

一、物理光学仪器及其附件

美 国

8,088,611	88-1	00001	輸送溶液的裝置, 光電傳感器, 積分線路以及檢測溶液成分的探測器所組成。當溶液停止送入噴頭時積分線路就可以自動的中止積分過程。	1959.1.6.	1963.
多格扫描水平接收器					
一个水平接收器包括用于光辐射的組合和探測器, 它把辐射轉化为电信号。使被扫描的物体的一点成象于探測器上, 扫描方法是有二个相反方向旋转的棱鏡被調節到产生連續多格瓣状体形的扫描, 当扫描过水平线时, 依賴于物体的辐射产生一个电信号。	1961.1.30.	1963.			
8,071,037	88-14	00002	折射仪	1958.7.21.	1963.
比率测量的分光光度計			这是用来檢測流动液体成分变化的仪器。在导管中流动的液体依次通过两个透明的腔室, 第一个腔室的內、外壁分別与第二个腔室的內、外壁相平行, 而每个腔室的內、外壁互不平行。有一光束逐次通过第一个腔室的外壁、內壁、第二腔室的內壁、外壁。一旦流体折射率連續地产生变化, 腔室就会使光束偏折, 即能测量出来。		
双光束分光光度計包括一信号发生装置与一个标准信号发生器, 前者产生一参考信号与一个試驗信号, 經過放大器后, 有一線路接收并记录其比值, 有一差异探測線路去探測参考信号与标准信号的差异, 根據此差异, 由一反馈線路来控制放大器的放大率。	1958.9.22.	1963.			
8,072,011	88-14	00003	应力测量装置	1959.10.20.	1963.
干涉仪光学系統			一偏平的垫圆形的光彈材料試驗片, 它的外圓柱面与內圓錐面都是內反射面。試驗片的下表面附着在工作物表面, 当工作物表面产生形变后, 試驗片的下表面就引起几乎同样的应变。在其上表面有一偏振元件连接, 通过偏振元件的光达到圓錐反射面再垂直地反射到圓柱反射面, 反射回来, 經圓錐面反射出来, 再一次經過偏振元件。可用于分析工作物表面上的应力。		
干涉仪包括光源, 分光器, 安放被試光学反射装置的座架, 以及干涉条紋觀察装置。光源发出的一支光束, 被分光器分成二支平行光束。由反射装置返回的反射光束在分光器上形成反射装置的重迭象, 重迭部分包含的条紋与二支光束在重新汇合前光線的弯曲量相当。	1957.5.24.	1963.			
8,074,308	88-14	00004	浊度計与控制系统	1956.6.4.	1963.
分光器			待分析的液流环路經過一个由热导材料构成的試樣槽, 此槽可以控制到一定温度。有光辐射通过此試樣槽, 其透射光束与散射光束交替地被一接收器所接收, 并有装置对其两束光进行比較。		
在分光器内, 一个气体燃燒器可以使試樣燃燒的火焰达到高的强度及稳定性, 由一过滤器可以过滤掉不要的光譜及将火焰的热量隔离, 一个光敏电阻放在真空室内, 对着火焰的发射光線, 由于能源的变化而感应产生的电阻变化可由一标准欧姆計測量出来。	1958.11.3.	1963.			
8,074,309	88-14	00005	分光計	3,079,884	88-14
火焰分光光度計			該分光計备有固定瞄准器和观察筒, 并利用一旋转盤和一随动構件, 后二者用一桿相连。随动構件为一螺旋副, 通过此种結構安排和相互运动, 即可得到波长数值。	88-14	00009
火焰分光光度計由吸入式噴灯, 贯存燃燒溶液的容器,					

1955.6.28.		1963.	1960.2.25.		1963.
3,080,788	88—14	00010	3,089,882	88—14	00015
能自动修正校整誤差的分光仪器			分析液体用的方法和设备		
分光仪器包括有激发装置，以使化学样品产生特征辐射，色散后，有测量装置接收其谱线能量。同时还包括一控制装置，产生控制辐射，经色散装置后出现为单光束形式。有一扇形板装置把其单光束分割为交替的两部分。一个包括接收器的辅助装置与色散装置连接起来，以接收通过扇形板的控制辐射。辅助装置与扇形板同步，以控制色散装置与出射装置的相对位置。			利用对选定波长的电磁辐射吸收来分析试样成分，该方法是引导一单光束经过试样流，使光有所吸收。由于该光束经过第一、第二两个波长狭带，测量在该二选定的波长上透过辐射总能量之比率，该比率指出所需分析的样品的成分。		
1960.2.18.		1963.	1959.5.26.		1963.
3,080,789	88—14	00011	3,090,278	88—14	00016
流液槽			分光计谱线对正的自动装置		
液槽的相对两壁的一部分交替由透光材料和反射光材料做成，当液体自槽中流过时，流液槽可用于对液体中所含成分作光透射特性的分析。			此光谱仪器包括一发生辐射的光源装置，入射狭缝，衍射光栅，辐射展成光谱线后的多个出射狭缝，一选择狭缝以使被选择的一谱线通过，以及各出射缝后的光电检测装置，上列各部件以待服装置控制而达到自动调整，正确接收。		
1960.7.1.		1963.	1960.3.22.		1963.
3,082,664	88—14	00012	3,090,279	88—14	00017
测定应力的光学仪器			使用衍射光栅的干涉仪		
此仪器可测量能透光与内反射光线之材料的双折射与内应力。被检材料呈平行平板形，有一透明的折射体与其上表面光学接触。经由此折射体而来的、偏振面倾斜于入射平面的偏振光束通过其平板上表面而不产生偏折与反射，它倾斜地进入平板，并从平板底面产生全反射，再经过透明折射体而出。有装置对其反射光进行测量。利用一些光学装置可以使光源投射的光，与被测量的光都在平板表面的法向上。			干涉仪由一透射与一反射光栅平行地放置而组成。第二个光栅的线密度加倍。入射于透射光栅的平行光并被发散后的两束光沿原路反射回去，结合成一束光以供观察。		
1957.8.23.		1963.	1960.5.13.		1963.
3,086,422	88—14	00018	3,090,998	88—14	00018
辐射的检查设备			比色计		
物体的颜色与光谱选择性的鉴定设备包括由控制装置以周期性改变其光谱的辐射照明物体，由检查器接收，并即时感知来自物体的辐射的瞬时总强度。			比色计包括一只长的不透光的外壳，在外壳内部在第一端有一个光源，在第二端上有光象。内部有三个反光镜，另有一个可旋转的标准颜色软片盒装在外壳内部。		
1955.10.4.		1963.	1959.8.26.		1963.
3,088,864	88—14	00014	3,076,875	88—23	00019
分析气流中的质点之方法和仪器			带线性吸收标尺的色度计		
介绍一种定量确定存在于气体介质中有毒物质之细小颗粒的方法。燃烧所收集的样品，将燃烧样品所发出的光变成电，以给出与存在于介质中的有毒物质的数量相应的连续信号。			有一装置投影一光束通过被分析的样品，用光敏电阻接收通过样品的光。光敏电阻作为第一臂接入一个四臂电桥并用三只固定电容器分别作为第二、三、四臂接入电桥，以跨过光敏电阻与第二电阻器的结点和第三、四电阻器的结点之间的电压作为对数放大器的一个输入，跨过第二电阻器的电压为第二输入，放大器的输出正比于此两电压之比的对数。		
— 2 —			1960.7.29.		1963.

英 国

			1956. 2. 18.	1963.
914, 038	97(1)	00020	1, 143, 040	42 h, 20
干涉仪			測量吸收用的測量皿	
干涉仪采用一个光栅把一束光分解成二个发散部分，利用一个反射器把发散光束反回到光栅上使重新形成一个单光束，这时，即能观察到干涉现象。			測量皿的两面窗子由反射膜作成，反射率最少有90%， 1962. 2. 17.	1963.
1961. 3. 8.		1963.		
918, 885	97(1)	00021	1, 143, 041	42 h, 20
分光计			貫流式試样槽	
用于远红外光谱的分光计，一个同心圆绕射板可以使一个光源产生一连串的光源象，每一个象相当于不同的波长，并且这些象是排列在一条通过同心圆绕射板中心的直线上，一个辐射接收器也安装在这条直线上，象和接收器可以相对移动，使象能连续不断的射到接收器上。			这种試样槽是使流动物质中的一部分流过槽内，以达到连续研究的目的。它的特点是用二块相对距离很小的窗构成了試样室，在試样槽的外圍上装有使流动物质贯流的管道。	
1961. 5. 9.		1963.		1963.
925, 390	97(1)	00022	1, 143, 342	42 h, 20
光学狭缝机构			单色仪	
光学狭缝机构用于分光光度计上，它是由二夹片装在移动架上，以调节缝的宽度，在调节过程中，可以避免狭缝中线位置之改变。			由轴外的非球面构成，入射狭缝和出射狭缝位于射向反射镜的子午主截面上。	
1961. 11. 17.		1963.		
926, 028	97(1)	00023	1961. 3. 15.	1963.
偏振计				
偏振计中的大部分光学零件都是由特殊玻璃组成，例如组成偏振器的保护玻璃，样品窗，透镜和法拉第池的心棒的玻璃都是由70~80%的氧化铅和20~30%的硅组成。			1, 144, 497	42 h, 20
1960. 7. 22.		1963.	用于光学仪器的狭缝结构	
927, 042	97(1)	00024		
光度测量装置			介绍一种单或双狭缝装置，它通过二组在长度方向加有预张力的板簧使狭缝架紧靠导轮运动，从而保证运动的稳定，并简化了结构。	
采用一个光束调制装置，在一个调制频率上进行测量，调制器是一个转动的不透明的扇形光阑。				
1959. 8. 14.		1963.		
1, 147, 404	42 h, 17	00025	1960. 12. 14.	1963.
用浊度滴定法来研究非单一分子，特别是高分子物质的根据单光束原理制造的自动光度计				
此光度计是由真空光电管及电子选频放大器所构成的交变光光度计，它是一种广为流行的型式。			1, 145, 378	42 h, 20
			采用高真空气腔产生远紫外区内摄谱研究用的自明蒸气装置	
			装置的特点是采用了主阳极，引燃阳极及由引燃阳极所包围的组合阴极——主阴极及引燃阴极所组成。引燃极是保证由0.5~2微法电容用20~40千伏电压所生成的火花穿越于阴极与阳极之间而达到产生远紫外区摄谱蒸气的目的。	
				1963.
			1, 146, 278	42 h, 20
			测定波长范围的光谱方法及装置	
			光束通过作为吸收介质的原子线后，来测定其透过的光谱以确定波长范围。这种光源或吸收介质都受到塞曼效应的影响。	
				1963.
			1, 150, 218	42 h, 20
				00032

西 德

1, 147, 404	42 h, 17	00025		
用浊度滴定法来研究非单一分子，特别是高分子物质的根据单光束原理制造的自动光度计				
此光度计是由真空光电管及电子选频放大器所构成的交变光光度计，它是一种广为流行的型式。				

偷琴射綫測角仪上的极向图记录装置	1,147,406	42 h, 36	00088
采用这种装置能使处于不同空間的試样所測量的偷琴射綫光強记录在一螺旋的平面上。記錄的螺旋綫相对于試样轉動是按一定方式进行耦合的，利用檢波电压按一般电气方法来操纵，記錄笔的运动记录于螺旋带上。			
1961.7.17.	1963.		
1,150,824 42 h, 20	00088		
在攝譜法中产生試样蒸发的电弧发生器	1,144,505	42 h, 38	00089
这种发生器应用高頻脉冲发生器来控制电弧脉冲数，同时又采用了电学計數器来记录通过电弧的电流脉冲，并按预定的数目来关闭高频发生器。进一步可以采用一种控制电极溫度的装置，当电极达到预定溫度时，就会暂时关闭高频发生器。			
1961.6.9.	1963.		
1,144,502 42 h, 34	00084		
光电扫描装置	1,317,465	G 02 b	00040
扫描漫反射面的装置，在通过的漫反射面上，聚焦生成一个小光斑，同时在垂直于移动方向有一个作周期运动的光組，当被照射的面达到某一定的条件时就被剔出来。		光柵分光度計	
1961.7.14.	1963.		
1,145,823 42 h, 34	00085		
透射干涉仪	1,318,620	G 02 b	00041
透射干涉仪有两个成象光組，比較光路中有部分透光面位于物体的一平面上或在它的前面作为分光面，物体的另一面位于两光組的中心，光的会合面見 1,126, 645号专利說明，特点是适于显微之用。		受激发射光源的改善措施	
1961.3.14.	1963.		
1,147,051 42 h, 34	00086		
干涉仪	1,321,848	G 02 b	00042
特点是在两束光路中之一的中間放置平行平面板，表面的一部分可作为分光器(4)或合光器(12)之用，光路中放置一块位相板，把通过的光綫位相变更 180°，并有数干涉条紋的装置。		光脉泽材料及由此制成的设备	
1957.9.4.	1963.		
1,144,504 42 h, 36	00087		
折射仪	1,322,357	G 02 b	00043
由固定的測量棱鏡和可以分开的望远鏡組成，物鏡可繞着光軸上一点轉开。		溫度补偿的折射計	
1960.8.8.	1963.		

法 国

象，折射角是待測試折射率的函數；光偏轉及溫度补偿的光学机件(25)是以光路取向的。由此可使依据溫度变化的偏轉角，能因上述进入面上待測試物件的折射率的增加，而同时增大。		主波形及多普勒鏡中心間差值的測定。
1962.2.20.	1963.	1962.7.6. 1963.
1,323,829	G 02 b	00044
固体状态的脉泽		
脉泽元件是与激励装置相耦合，以供给一受激的辐射，各个反射器耦合这个元件以形成一个受激辐射的谐振器，由此可射出一输出光束。专利所规定的脉泽元件是有三质点能级的荧光材料及激励装置可产生一脉冲激励的辐射。		发明所述及的是一种脉泽的革新技術；脉泽的晶体(1)，如紅宝石，是顺着透明的石英质环状容器(4)的軸放置，容器中有氩气环流，一个装置在其外面的感应线圈(3)，由高频发电机(7)馈电使之在等离子区(2)产生放电，其光辐射作用激励晶体(1)；容器壁(4)是用一种透明流体在透明的套层(5)及(6)中循环流动而冷却。
1962.4.9.	1963.	1962.5.15. 1963.
1,324,159	G 02 b	00045
光脉泽		
用来操作連續波的固态光脉泽包括有一活性脉泽材料的軸，在軸端部的对面有一带有一对反射元件的裝置以組成包括軸在內的一个谐振腔，一个包括光源在內的裝置用以达成激励。		设备的特点是用分光板将单独一个光源所发出的光束分成二个測試光束。保证这二个分光束之間同相的方法是：一方面用放置在光源及分光板之間的平面起偏鏡作周期性轉動；另一方面是用二个分析鏡分別放置在二支光束內，起偏面彼此斜置。
1962.4.4.	1963.	1962.7.17. 1963.
1,324,245	G 02 b	00046
分光度計		
分光度計包括有一个，用以放置光学元件(13)、(14)的摆动平台(15)及一些电磁装置，可以将一个周期性变化的力加諸这平台之上，使之保持可以作有固定频率的摆动。各项电磁装置是用一个带有可以反映出平台位移信号的光敏设备来操作。		将光脉泽浸漬入一种有同样折射系数的液体中，以避免脉泽晶体端部装配上的各项困难。
1961.2.28.	1963.	1962.7.24. 1963.
1,326,187	G 02 b	00047
光脉泽		
固态的光脉泽包括有一长圆筒形的盐基晶体，其端面是扁而平行的，盐基晶体上积沉有薄膜状的負溫度系数的介质；在各端面之間，有一个，由反射涂层沉积在薄膜端表面上所形成的空心光谐振腔。		光縫的成象，在扫描表面上呈一点。这是用一聚光鏡，一物鏡，一轉动的反射鏡及一个与反射鏡軸相横截的圆柱透鏡来获得的。由表面反射的散射光縫被迫通过光学系统，投射到放置在狭縫上下的一個光电机件上。专利的特点是聚光鏡应較物鏡的开口为小，由此可使设备不致受扫描表面的位置改变的影响。
1962.6.22.	1963.	1962.7.17. 1963.
1,328,185	G 02 b	00048
光脉泽		
所設計的光脉泽可以稳定地輸出频率，在气体光脉泽中，可以发现波形频率的一种非綫性位移。一般情况下，波形是向着多普勒扩展发射鏡中心移动的。由此各项选定的波形偶所产生的跳动之間的差值可以供作		脉泽包括有一脉泽材料的元件及各种使能量急遽升降，激励脉泽材料以产生受激辐射的发射的装置。这种装置包括可提供长而强力的脉冲以激励在临界振蕩的材料及較弱而短促的循环脉冲。
1962.7.27.		1962.7.27. 1963.

1,318,797	G 02 d	00054	譜，然后相互进行比較。借助电位計游标線括的觀察 光譜板及相类信号板的分析方法及设备 在框架 10 上，并列地投射待測試譜板 (20a) 上的象 及标准譜板 (20b) 上的象以分別重現未知及已知的光	1962.1.12.	1963.
-----------	--------	-------	--	------------	-------

二、光学計量仪器和測試技术

美 国			1961.9.29.	1963.
8,071,085	88—1	00055	8,084,590	88—1
光学的量表讀數系統			光学系統	00059
一个裝置在帶有窗口的封閉室中的量表，有一个可以 前后調節的放大鏡正對其讀數标记，靠近窗口有一潛 望鏡裝置，其上部的鏡子朝向放大鏡而向下傾斜，下部 的鏡子朝向窗口而向上傾斜。通过窗口可以在下部鏡 子中看到讀數标记的放大的正立象。			叙述了一种光学系统，它可以傳送出与衍射光柵的參 数成一定函数关系的光。	
1959.6.12.		1963.	1959.2.16.	1963.
8,071,086	88—1	00056	8,072,012	88—14
章动扫描鏡			皺紋測量方法	00060
一个章动的扫描鏡有一順磁性的圆形支架，四周有四 个电磁铁与其相触，支架中央固着一个磁性樞軸，軸上 頂着一順磁性的鏡子，触与鏡子底面磁耦合，此鏡子处 于力学平衡。鏡子底面与周围的四个电磁铁极近，因 而能产生磁耦合，輪流供給这四个电磁铁电能，就会使 鏡子产生章动的扫描。			此裝置是用来測定柔軟物质表面的不規則性。第一步， 产生一条橫貫該物质表面的屋脊線；第二步，投影出這 段線的輪廓阴影；第三步，利用此輪廓阴影可以获得沿 着該輪廓阴影的每两个相邻点的高度差的总和。	
1960.8.31.		1963.	1959.4.28.	1963.
8,073,210	88—1	00057	8,073,212	88—14
棱柱的反射装置			用于檢查磁性材料中分子集中的光学設備	00061
光学材料构成的棱柱反射装置有一圓柱形的外表面， 中間打通，內表面呈半截圓錐面，致使上表面为环形， 下表面只有錐面与柱面的交綫。这样的表面排列使得 能在上表面看到邻近圆柱面或置于圆柱面上的物体的 反射象。			此仪器是用光学檢查方法去發現磁性材料試样的缺 陷，包括磁化試样的設備，充磁的設備。在和缺陷方向 平行的方向內，安放了一長槽，一个移动反射鏡的設 備，可将穿过長槽由試样的一平面上反射来的光綫进入 光电池，当在缺陷上的反射光綫减少，就产生一信号 表示了一个缺陷。	
1959.1.19.		1963.	1957.8.14.	1963.
3,075,425	88—1	00058	8,076,874	88—14
量尺			測量位移的系統与机构	00062
量尺包括一具有纵向凹槽的尺体，在体内的一块金属 底板上，以固定的間隔排着許多分划尺标记，一彈性支 架放在槽內，其上具有相当数量的孔对准在每一个分 划尺标记上，孔內放了一玻璃板倾斜于分划尺标记的 平面，并可以繞标记面垂直的軸旋轉。			此系統包括一个产生基信号的裝置以及一个信号发生 器，后者包括一个长条形元件。光源发出的通过此元件的光 流由一單向的扫描裝置調节。一个線路响应于这調节的光 流去产生一个一定频率的周期信号。当长 条形元件相对于扫描裝置位移了一个待測量的距离， 所产生的信号就会相对于基信号有了一个位相变化。 利用相敏指示元件可以对此位相变化产生响应，从而 得知其位移。	
			1958.4.7.	1963.

3,081,665	88—14	00068	偏振光自准直仪
檢驗光学玻璃片的設備和方法			偏振光光电自准直仪由光源、偏振装置、能部分反射偏振光的分光器，准直装置、剖場分析器和光电檢測器組成。轉動的 1/4 波片置于分光器和剖場分析器之間，从反射元件返回的圆偏振光經過 1/4 波片后就被轉變成平面偏振光。
这是一种檢查玻璃片內部密度的設備，它是把一个光束照射到被檢驗的玻璃片上，这光束的焦点落在玻璃片后一块屏幕上，并从屏幕上反射到一些光敏元件上产生一些与照射到光敏元件的光量成正比的电信号，逐一摭蔽各个光敏元件上的光线，并測量各元件被摭蔽前后的相对变化，便可以决定被測玻璃的密度差的数量和方向。			1960.7.7. 1963.
1959.4.21.		1963.	
3,081,666	88—14	00064	檢查設備
檢驗設備			檢查跑动的紡織物上相繼印花的裝置包括支架上三个有一定間隔的橫導軸，當織物在其上成兩段直面拉過時，光線投入一多面反射鏡中，多面反射鏡如此裝置，使其旋轉速度與織物的跑動速度成一定時間上的關係。這樣從反射鏡的反射光中看來，跑動織物的印花實際上是穩定不動的。
檢查瓶体有否外來雜粒的系統，利用发送、調制能量和扫描裝置，在瓶体有外來雜粒處以特定的頻率給出輸出的指示信号以指明之。			1959.4.22. 1963. 1959.5.8. 1963.
1959.4.22.		1963.	
3,084,591	88—14	00065	3,089,381 88—14 00069
測定粒子平均大小的方法与裝置			反射比測量設備
使含有粒子的悬浊液从液庫流經至少有一小部分透明的管子，使光束透過此部分而射到光电裝置上，流动液粒造成的脉动光束在光电裝置中产生的脉动电流，与粒子的体积成正比。将脉动电流放大并把它的平均能量对时间积分，就可指出液中粒子的平均大小。			在存在着周围光線時測量油漆表面質量的方法，該方法包括接受来自油漆表面的反射光及油漆面邻近的光，把反射光轉化成相应的电能，把周围反射光的电能除去，以产生一个信号表示能量間关系的函数。
1958.3.3.		1963.	1959.11.4. 1963.
3,084,592	88—14	00066	3,091,154 88—14 00070
液管式測定器			反射計
長透明管內壁做成許多平面，它的两端做成引向外面的小通口用以把液体引入。在这样的內室中装有錐狀標牌并在其上刻度，內壁平面到標牌的距离由管的一端起到另一端逐漸增大，以便通过所盛液体觀察刻度，液体的不透明度，渾浊度等可由刻度綫的消失不見而定出。			反射計中包括有三个平面鏡可使自光源來的輻射沿一預定方向定綫反射；第三個平面鏡可移轉到一位置，以使从一置好的反射面來的輻射反射到預定的方向上去，这样外加的這一反射面的反射率就可借以量得。
1959.11.20.		1963.	1961.6.6. 1963.
3,085,466	88—14	00067	3,073,218 88—23 00072
干涉測角仪			測量光性质的裝置
这是一种光学測角仪器，它的結構是把一个光源分成二股光束和二个光路，光路中有反光鏡和導光鏡，有一个可以調节的支架，可以旋轉光源和反光鏡，最終使二股光束都射到反光鏡上。			此工具包括一个輕便的光学密封的偏平空盒，其一面壁上有一針孔，一个透鏡套于其上，以发散通过針孔进入盒內的光。一个顏色淡于盒的中心开孔的不透明元件盖在透鏡上，利用它与盒的顏色对比，可以目測平面上最亮与最暗的部分。一个光敏元件装在盒内，通过孔的軸心。盒的外部裝置与光敏裝置結合起来，发展了用于指示进入小孔并抵达光敏元件的光流量的目視方法。
1959.2.6.		1963.	1958.3.28. 1963.
3,087,377	88—14	00068	

3,076,876	88—23	00073	表面上作追迹运动的追迹钢针，一个与此钢针刚性相连的随动钢针。随动钢针被照明，只要它的运动范围不超出透镜视场，它的象就能被此物镜投射到观察屏上。
电子测量电路			1955.7.5. 1963.
电路包括一具有非线性电压-电流特性的单向传导的电子管阻抗设备，交变电流发生设备及低频矩形载波调制设备等，用来测量电信号。			
1961.6.27.	1963.		
8,087,879	88—23	00074	投影器
光强计与观察器的併合装置			它是用于显微记录仪的照明系统。系统中的一个投影物镜放在一个窗的下面，窗上就安放了记录仪。一凹面反射镜垂直地安放在白炽灯的一边；一个第一反射镜安放在灯的对面，使由曲面镜反射出来的光经它反射后横向地反射至第二反射镜，再穿过投影物镜及窗。
在光强计中以物镜将物体所发之光会聚于一光导原件上，和光强成正比的激发电流示于微安计的读数标度上而借另一端的目镜读得，电源的联接可用于不同范围的光强。			
1958.6.6.	1963.		1959.1.12. 1963.
8,078,215	88—24	00075	3,085,469 88—24 00080
光学记录系统			光学信息操作仪器和方法
这个系统由光源，使光束根据外加信号而摆动的装置，照相底版以及一个固定的延长透镜所组成。透镜可以使图象在它的长度方向伸长同时其结构可以保证光束摆动时在象平面上的光强度保持恒定不变。			光学信息操作系统包括：产生含有信息光束的第一套装置，在第一套光束通路中的使之产生光学象的第二套装置，介置于第一第二两套装置之间可变地修改含有信息光束的第三套可变的多色光学装置——这一装置反应第一、二两个辅助电磁波辐射而逐点地改变透射系数。
1959.7.6.	1963.		
8,076,877	88—24	00076	1959.10.12. 1963.
光学投影系统			
系统包含作为光源的灯和限定灯轴的支足，凹面反射器放在灯的后面将光线沿通过该光源且垂直于灯轴的方向反射到照明场中，灯和反射器的大小使得反射光束能引入支足主要部分的影子。承托灯泡的装置能绕光束的轴转动而使由支足形成的影子能在照明场中連續移动。			3,090,281 88—24 00081
1958.10.6.	1963.		光学系统
8,076,880	88—24	00077	这个系统包含有一个单色光源，放照片的装置，将光源投射到照相片上用的透镜：这些光被相片根据空间频率的不同而衍射，将照相片成象于象平面上的装置，这个装置中有一块滤色片，它面上不同点的光吸收度是各不相同的。
投影仪或用内部对焦观察物体内部的同类仪器			1961.3.13. 1963.
这种投影仪由一组固定的对焦光学系统来映出物体的轮廓影象。用一工具夹持物体使其在焦点工作范围内与对焦系统保持一定距离。一五棱镜置于对焦系统与影象屏幕之间。还有对焦附件和两面角反射镜，可将影象后延和相对地变化。			
1960.3.28.	1963.		
8,077,815	88—24	00078	3,087,882 88—26 00082
光学投影的轮廓检查系统			光学投影系统
介绍了一种具有大的追迹范围的光学投影的轮廓检查系统。它包括一个广角照相机型的物镜，一个在待检			此投影系统用来观察不透明物体的表面情况。仪器由载物台，投影物镜系统及二个照明光源等组成，照明光源等距地设在投影物镜光轴的二旁。
— 8 —			1960.1.26. 1963.
			英 国
8,077,815	88—24	00078	915,020 97(1) 00088
光学投影的轮廓检查系统			物象比较器
介绍了一种具有大的追迹范围的光学投影的轮廓检查系统。它包括一个广角照相机型的物镜，一个在待检			被比较的物件放在一块工作平面上，在它上面盖有一个罩子，罩子上面有一个屏幕，在它上面可以投射物件

的图象以便进行检查，用一个光学投影系统来将工件成像。			1958.6.25.	1963.
1961.6.13.		1963.	1,144,983	42 b, 21
915,686	97(1)	00084	锥度和长度的组合测量装置	00090
輪廓投影仪			锥度和长度的组合测量装置有一个基座，基座上有两个頂針軸，用来夹持被测的工件。一个支承在球体上的特殊拖板平行于頂針軸線作横向运动，一个同样支承在球体上的特殊滑板水平地并垂直于頂針軸線运动。	
是一个可同时投影平面截面(例如輪机叶片之截面)之两个輪廓的光学系统，該仪器还含有为照明被观察物之两截面的光学系统。				
1958.9.8.		1963.	1957.2.1.	1963.
925,726	97(1)	00085	1,143,338	42 b, 23
显微镜测量装置			精密测量靠表	00091
在显微鏡內用一光度計进行反射率的測量，或作由物鏡孔徑所确定空間角度內样品光散射的測量，仪器内有一裝置能使标准位于样品的位置，可以校正仪器。			精密测量靠表安装在工具机的心軸上，測量头通过杠杆与測量表相联系，由測量表示出讀数，可測工件内外徑及平面。	
1961.7.18.		1963.	1958.12.23.	1963.
926,506	97(1)	00086	1,144,934	42 b, 24
光学设备			导轨移动量精确測量和讀数的光学装置	00092
用来观察曲面，由二个光学裝置构成。第一个用来从在表面上所選擇点并沿参考綫成直角反射光綫，并指示出在綫上裝置的位置，第二个用来从选择点按一預定角度并沿参考綫反射光綫，指出在参考綫上裝置的位置，第一和第二个裝置可以分别是直角五邊形和成一角度五邊形。			其将刻尺投影到机床不同部分的讀數窗中，并且至少有一个光学元件，由于长度方向的行程誤差，在导轨傾斜时，相对于导轨行程保持不变，并連用一管形水准器以指示方向。	
1961.9.18.		1963.	1958.11.28.	1963.
西德			1,146,284	42 b, 24
1,143,033	42 b, 12	00087	对螺旋形纵向凹槽的拉刀进行螺距、斷面和分度选择檢驗的裝置	00093
长度和厚度的測量装置			在該裝置里，拉刀由轉動夾具夾緊并可旋轉，对檢驗的纵向凹槽的侧面用悬挂着的摆动接触裝置的触头來測量。其偏摆用測量記錄裝置來記錄，其摆动支座采用平行于拉刀纵軸和同步轉動的滑板。	
长度和厚度的測量装置，利用彈力同被測量的物体接觸，測量裝置包括触針和測量臂，在移动測量裝置彈簧張力的作用下，由指針和刻尺示出其移動量。				
1958.2.20.		1963.	1957.3.9.	1963.
1,143,034	42 b, 18	00088	1,142,066	42 b, 26
滑尺			断面投影仪	00094
滑动部份的上平面位在同一平面內，二个滑槽可进行調節，并配置可进行相对調節的机构。			断面投影仪至少具有可以照明二个斷面的照明裝置及一个反射器，这个反射器由一个支架和几块平面反光鏡組成。	
1960.10.28.		1963.	1959.9.11.	1963.
1,143,387	42 b, 21	00089	1,144,491	42 b, 26
量角規			光学断面測量仪器	00095
量角規由二个相对位置的測量杆和可进行粗讀、精讀的刻尺組成。			光学断面測量仪器具有与所測量的物体彈性接觸的測針。此測針与聚光鏡光源照明的投影系統的透鏡相連	

結,从而測針的移动引起光源光綫成比例的移动。			
1957.5.16.	1963.		
1,144,935	42 b, 26	00096	
回轉体表面相对位置的檢驗裝置			
物体的一个表面被安放在两个支点上,第二面以第一面作基准利用杠杆和測量表来进行檢驗。			
1959.7.18.	1963.		
1,147,762	42 c, 6	00097	
測定或調整裸綫垂度的設備			
其特征包括一支悬挂在綫上的可調整的铁条;一支可在铁条上进行量測的滑动尺;和一支以一端連結在滑动尺上,一端支在綫上的直尺。			
1960.10.20.	1963.		
1,148,279	42 h, 23	00098	
光学投影仪中的照明裝置			
整个結構单元由固定在支架上的白熾灯及反光鏡所构成。这时白熾灯置于反光鏡的最佳位置上。整个单元可以方便的插入电源插座內。			
1959.9.2.	1963.		
1,142,244	42 h, 34	00099	
两个移动軌道表面的无接触光电測試方法和裝置			
两个移动軌道表面的无接触測試方法系通过集象管得到光学可以識別的誤差,是通过电闪光的程序所产生的两移动軌道的象儲存起来和在两个电闪光間的时间中进行被檢表面誤差的測試。			
1960.12.10.	1963.		
1,143,345	42 h, 34	00100	
分类裝置			
对物体进行分类的裝置是采用了光电測量的結構,它是按各种不同顏色的型式进行分类的。整个裝置由一套光学系統,带有叉口的导光管及一些对某种顏色特別灵敏的光电管所組成。再由光电管所得之相对光强度来进行选择分类。			
1959.10.20.	1963.		
1,148,281	42 h, 34	00101	
光波干涉精密量測一个回轉用的裝置			
这种裝置特別在光学量測仪器中見到。在一个轉動座(40, 41)上經一联节(44)固定一个具有两臂(45, 46)的角状杠杆。这些构件(40, 44, 45, 46)系由彈性影响少的合金制成。在第一臂(45)上固定第一块平板玻璃			
(20),在它的背向光源一面局部的涂有反射膜,在第一块平板对面倾斜成一定角度固定第二块平行平板玻璃(19),它的向光源一面亦局部涂膜,其余部份系透明的,因此轉動座(40, 41)的轉动当作角度变动能在两平板中用光波干涉法測定。在第二臂上有一螺旋裝置(51, 52)起作用,使两臂(45, 46)經一可以彈性变形的联节(44)对轉座(40, 41)以及相对于第二块透明平板(19)的角度位置在量測开始时測定。			
1958.10.14.	1963.		
1,144,503	42 h, 35	00102	
檢查玻璃缺陷的裝置			
本专利为用光源和觀察屏檢查玻璃缺陷的裝置,直射的光綫不能到达眼內。			
1956.8.29.	1963.		
1,144,944	42 h, 35	00103	
單一透鏡的連續檢驗法			
放在带有标准透鏡的可更換鏡框中的待檢透鏡,在应有的位置上同标准透鏡暂时組成整个系統,檢驗待檢透鏡的不同制造誤差的总影响是否在規定範圍內不改变系統象質。			
1958.12.24.	1963.		
1,145,882	42 h, 35	00104	
頂点曲率計,特別用于測定柱面眼鏡			
頂点曲率計有两列分度,一列和沿軸向运动的測量标记相联接,另一列为測量球面折射力,不与測量标记相联接,当要測量柱面时又可通过一个凸起和測量标记联接起来。			
1960.9.13.	1963.		
1,146,283	42 h, 35	00105	
測量光組對村傳遞函數的方法和仪器			
測量的方法是在物平面上用一个由非相干光綫照明的运动的矩形光柵,它的光柵常数逐渐减小,在象平面上有观察狭縫,通过光电扫描的办法来記錄它的强度随时间变化的情形。			
1960.3.25.	1963.		
1,144,022	42 h, 37	00106	
頻閃測速仪的線路			
在多諧振蕩器的柵极回路內接上了一只分离变压器。			
1960.3.4.	1963.		
1,147,052	42 h, 37	00107	

閃電光-頻閃觀測器的角度控制，角度系不变的常数，用以观察不同的旋转机器		1,821,540	G 02 b	00112	
关于观察不同轉數的物体是由光电脉冲发生器作控制 閃電光-頻閃觀測器用。光电脉冲发生器由光源，光 电管和与物体同步的光闌組成。特点是一个楔形光闌， 在光源的光綫不变时，它的孔口因离心力的作用随轉 數的关系而变更。		反射表面的定方向标設备			
1960.9.29.	1963.	固定取向反射表面的測位光学設设备，特別适用于液体 自由液面的标准。設设备包括有一对相互交叉发光的物 体，一个使上述物体在一光敏元件上形成图象的光学 設设备，来自定位表面上物件的光束反射后，再使之通过 一个可以在給定的位置上遮蔽其中一图象的狹縫，通 过一个光敏元件来示出反射表面的全部位移。			
	1962.2.7.	1963.			
法 国					
1,819,100	G 02 b	00108	1,822,585	G 02 b	00113
快速及逼真的投影方法及設设备		测定长度的設设备			
用以确定图象清晰度的方法，使一预定平均亮度的图 象投射在具有非綫性光度-电阻曲綫的光电元件上；改 变图象的清晰度并探测由于清晰度变化而引起上述元 件的电阻变化。		这种設设备是用来对支架与可观察的光学系統相对移动 的比例尺作精确的分度。刻度綫連續使一定数量的光 电池受感应，从而由于补偿而产生出信号。这些光電 池是有規律地分布成二組，每組分列成串联或并联，而 刻度綫的放大部分不断使其中一组光电池受感应。			
1962.4.4.	1963.	1962.5.12.	1963.		
1,820,366	G 02 b	00109	1,822,669	G 02 b	00114
飞机测高的指示器		测定仪器的革新措施			
指示器包括有一个可变量尺度的指示机件及另一用以 說明有关量度变化的指示机件。		与比例尺(10)相配合的計数头表面(13)，其对峙的表 面或甚至比例尺本身都是用許多小平面(14)-(15)所 組成，由此使比例尺上各个不同位置所发出的光束能作 不同程度的偏移，一方面避免了落在測量仪(17)、 (18)上的由比例尺发出的光綫有减弱趋向的表面反 射，而另一方面则可逐一产生来自比例尺的多相信号。			
1962.4.12.	1963.	1962.5.21.	1963.		
1,820,868	G 02 b	00110	1,823,827	G 02 b	00115
确定与参考面相关点位置的方法及設设备		适用于装盛在透明容器內液体的检查仪器			
首先以投影仪，光学系統及接收仪所各附有二个光柵 的交切点，分別作为第一、第二及第三光段部分。然后 以此三部分所定出的平面作为参考面。将待定点与其 他二项不用于确定参考面設设备的点相联接。移动由此 选定的設设备，使其所属的光段部分加到不同性质的光 所組成的光束的分界綫内。		特別适用于檢查盛装在透明容器內液体的仪器包括 有：一个輻射能源；一个使这均匀輻射光束在檢查行程 上移动的設设备；一个固定的光学装置以接收光束在行 程上运动时的輻射能；一个檢測裝置用以檢查通过光 学装置后这輻射能的强度变化。			
1962.1.31.	1963.	1962.4.9.	1963.		
1,821,138	G 02 b	00111	1,824,570	G 02 b	00116
照相或相似用途的物鏡的质量控制方法和設设备以及綜 合的二用仪器		光电控制的設设备			
試体T的象，經過显微物鏡M，在所校驗物鏡的象面 上形成；图象被投影至无穷远并形成試标T'。利用自 准直仪A将其反射送回至試体之上。落在試体透明部 分的反射光綫，通过光学設设备S ₁ B ₁ 投影在光电池F ₁ 上。自准直仪所反射的光綫則通过試体T的不透明的 反射部份以及光学系統S ₂ B ₂ 投影在另一光电池F ₂ 上 并加以測定。		利用光扼流小槽的閉塞或釋放，來控制一种保护，启停 或相类的工作。設设备的特点是有二个光的扼流小槽， 裝置成一前一后，并且可以分别，单独地进行閉塞或釋 放，來操作。此外还附有一些补助机件。			
1962.4.20.	1963.	1962.5.15.	1963.		

1,828,095	G 02 b	00117	日 本	昭38-2581	104 G 1	00119
輻射的變換設備及缺陷的檢驗器			透鏡檢查裝置			
這些檢查用的裝置可產生一個檢查表面的倒象，在象中明亮與黑暗的部分相反，而對輻射靈敏高的裝置接收倒象可以在一運動的薄片上示明一以缺陷。			此透鏡檢查裝置包括順次設置的有黑色部分的分劃板、透鏡支持具、與上述分劃板在光學上或陰陽關係且上下、左右相反的濾光器、光度測定器等幾個部分。			
1962.6.29.		1963.				
1,829,272	G 02 b	00118	1959.3.31.			1963.
視測比較的光學設備						
為了將校驗物件與標準樣件作比較，可以將這二種物件的象疊置起來：其一是直接由通過光束來形成；另一則用反射的光學元件間接投射。這種設備的特點是所應用的反射光學元件是一個以較照明光源閃爍頻率為高的速度轉動的扇形反射鏡。			昭38-1597	104 G 2	00120	
1962.7.19.		1965.	此裝置特點是：照明用電燈之插頭用軸裝在此檢查器鏡筒前端的軸承內。此燈座可自動地與鏡筒光軸偏轉一定角度。			
			1960.2.27.			1963.

三、大地測量儀器和光學觀察儀器

美 国			3,079,835	88-14	00124
3,082,663	88-2.8	00121	准線經緯仪		
多用途的袖珍磁羅盤			用來決定一遠物點的角度偏差的系統包括：產生一對分離的輻射線的裝置，調整射線對準遠處的反射裝置的機構，接受反射回的射線的狹縫機構及對輻射能敏感的，用以產生相應信號的裝置。		
此羅盤由底板、透明羅盤盒、第一度盤、帶有磁針的第二度盤、傾斜擺及雙反光鏡系統組成。二度盤可分別繞垂直軸旋轉，在其上讀取方位值；傾斜擺有帶刻度的反射面，用來確定底板對於水平面的傾斜度。			1959.1.14.		1963.
1960.2.2.		1963.			
3,085,465	88-2.8	00122	8,076,381	88-34	00125
帶反射鏡的攜帶式水平儀			一双筒望遠鏡上透鏡筒控制機構		
該攜帶式水平儀為一空心體，頂壁上有開口，外裝蓋板，反射鏡裝在裏面。前端有小窗口，後端有小縫隙，二者構成主要瞄準軸。水平泡可從前端小窗或頂壁開口看到。該水平儀底面傾斜，置於與瞄準軸平行的平面上。它可作觀測水平儀用，亦可作測定水平面的基準面用。			一双筒望遠鏡具有一對目鏡和一對物鏡系統及兩個結實的框，矩形的透鏡框可移動地裝在一個中心支承元件上，可使其間的距離相符合。改進後的結構是在一個可對矩形透鏡框作相對移動的套筒內；裝着透鏡，套筒外有一徑向的凸緣，介於凸緣和框間裝了一彈性機構，一橫向裝置在中心支承器上的調焦杆伸到每一個座子內，在視場邊緣，具有平行及傾斜的支承面的調焦杆接觸着可動套筒的內端面，從而克服彈性力而推動套筒。		
1959.4.30.		1963.	1960.2.5.		1963.
8,079,833	88-2.7	00123	8,076,382	88-34	00126
適應彈道曲線變動而調節分劃板的測距及射击瞄準器			雙眼望遠鏡的鏡片排列		
利用分劃板、光學偏向器和與之耦合的兩個凸輪的相互連動機構，適應改動了發火條件而修改的彈道曲線，為武器進行測距及射击瞄準。			這種雙眼望遠鏡的目鏡是圓的，而物鏡的二邊是圓的，其他二邊是平的，這種望遠鏡的物鏡有幾片，裝在可以伸縮的套管內，而保持光軸同心。		
1958.10.13.		1963.			